

X-MET8000
GEO

HITACHI
Inspire the Next

日立



[采矿]

及时的样品分析对于采矿作业来说至关重要，可以提高采矿的发现成功率、生产率和利润。

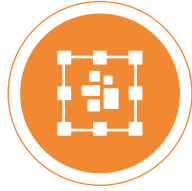
X-MET8000 Expert Geo 是一种手持式X射线荧光 (XRF) 分析仪，用于采矿过程各个阶段的地质化学分析。该仪器使用方便，有助于大幅降低实验室分析的需求及其相关成本。使用X-MET，您可以现场作出决策，而无需等待数小时甚至数天以获得实验室分析结果。

相比于其他手持式 XRF 型号，我们的大面积硅漂移探测器 (SDD) 和革命性的 BOOST™ 技术可提供精确测量关键元素（例如杂质元素）所需的低检测限。

X-MET集成了 GPS，可将地理位置数据与分析结果相结合，实现完美的现场地图绘制。该仪器也与 Trimble® 接收器配合，获得更准确的位置数据。



为什么 X-MET8000 Geo 是您企业的理想之选？



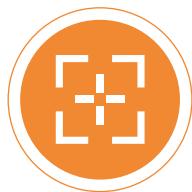
满足了您目前及未来对检测的要求

使用我们的采矿校准可测量最多40种元素；量化稀土元素，例如La、Ce、Pr和Nd，并可测试各种类型样品，例如岩石、岩心、岩屑和粉末。



性价比高

X-MET可承受最恶劣的环境和天气条件，其具备 IP54 防护等级（相当于NEMA3），有着超高的防尘和防水性能。该分析仪符合MIL-STD-810G军用级强度标准。



操作简单

大图标界面非常直观，易于使用，戴上手套也不受影响。可自定义的 4.3 英寸彩色触摸屏，即使在阳光直射下也能清晰地看到检测结果。只需进行最简单的培训。



高级数据管理

多种报告格式可选，可直接下载到 U 盘，或通过 USB 数据线传到 PC上，也可利用 WiFi 或蓝牙实现网络共享。



使用舒适

轻便性 (1.5 kg)、符合人体工学的设计以及 10-12 小时的电池寿命可确保工作流程不中断，长时间使用不会感到劳累。

为整个采矿过程增值



探测和采矿地图绘制

快速筛选各种元素（Mg到U）。BOOST™技术可提供低至ppm水平的检测限和快速分析，确保现场识别所有关键元素，以便作出决策。



现场挖掘控制

节省时间和金钱：减少寄送到实验室以进行选择性采矿和制定生产计划的样品数量。识别矿石储量的边界，尽可能减少废石的挖掘量。



分级控制

监测矿石中关键元素的浓度，并且在基本上不需要准备样品的前提下准确识别痕量元素。



过程监测

将 XMET 拿到不同地方，测试所在地的储量、进料、浓度和尾矿等，并快速制定流程调整决策。



环境管理

测试采矿废石和尾矿是否会对周边环境造成潜在影响，制定相应的废石管理计划，并且将危害较轻的元素降至 PPM 级别。

满足您需求的选择



我们为您提供两款不同型号

	X-MET8000 Optimum Geo	X-MET8000 Expert Geo
说明	快速可靠地测量各种地质化学样品和浓缩物。	拥有测量各种地质化学样品的极限性能，包括稀土元素、轻元素和质元素。
X射线管	45kV	50 kV
X射线管过滤器		6位滤光轮
探测器	采用BOOST ^(TM) 技术	采用BOOST ^(TM) 技术
元素范围		Mg – U
稀土元素（REE）	否	是
具备IP54防护等级和符合MIL – STD – 810G	是	是
重量（含电池）	1.5 kg	1.5 kg
电池连续工作时间	10 – 12小时	10 – 12小时
防止探测器窗口损坏	防护窗 口	聚丙烯窗
校准	无标样定量分析轻元素	无标样定量分析轻元素和稀土元素

硬件和软件选配

特征	X-MET8000 Optimum Geo	X-MET8000 Expert Geo
蓝牙	标准配置	标准配置
WiFi	标准配置	标准配置
集成摄像头	可选	标准配置
小点准直器	不可用	可选
报告生成器	标准配置	标准配置
ExTOPE Connect云连接和移动应用程序	是	是

我们的服务

我们的全球服务中心提供全方位的技术支持。

技术服务台

对您的问题快速解答。

在线诊断

通过互联网提供深入支持。

仪器租赁

当您的分析仪不工作时，您也能工作。

再认证与维护

确保您的分析仪能够年复一年地提供正确结果。

培训

了解您的分析仪及其功能。

延长保修期

降低计划外成本。

耗材与附件

从备用电池至台式支架。

维修

实现高效快速周转。

下一步

立即联系我们的专家：

contact@hitachi-hightech.com,

以安排样机演示。

更多信息

如需了解有关 X-MET8000 Expert Geo 分析仪的更多内容，请访问

www.hitachi-hightech.com/hha

销售热线：400 621 5191



其他产品

我们拥有45年多提供行业分析产品的丰富经验。

X-Supreme：用于进行流程和质量控制的台式 XRF 分析仪。

在线浏览我们的全系列产品：

www.hitachi-hightech.com/hha



Hitachi High-Tech Analytical Science

本出版物的版权归日立分析仪器所有，且仅提供概要信息。未经公司的书面许可，任何人不得以任何目的使用、应用或复制本出版物，或将其用于任何订单或合同。本出版物不可用作产品或服务相关说明。日立分析仪器的政策将持续改进。公司保留更改任何产品或服务的规格、设计或供货条件的权利，恕不另行通知。

日立分析仪器承认所有商标和注册。

© 日立分析仪器，2024年。

保留所有权利。